

АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

«Физические основы измерений в технологии наноструктурных материалов»

Направление подготовки 27.04.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

Профиль Метрология наноструктур и нанотехнологий

Квалификация выпускника магистр

Нормативный период обучения 2 года

Форма обучения очная

Год начала подготовки 2017

Цель изучения дисциплины:

получение студентами основных научно-практических знаний о современном мировоззрении на физическую картину мира и получения данных об объектах;

Задачи изучения дисциплины:

получение знаний о физических явлениях, лежащих в основе измерений и создания эталонов

Перечень формируемых компетенций:

ПВК-1 - готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при решении практических задач, разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок, подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок

ПВК-4 - способность анализировать и синтезировать, находящуюся в распоряжении исследователя информацию и принимать на этой основе адекватные решения

ПВК-5 - исследовать причины появления некачественной продукции на производстве и разрабатывать предложения по предупреждению и устранению причин низкого качества продукции и управлению несоответствующей продукцией

ПВК-6 - производить оценку качества измерений, контроля и испытаний, обеспечивать эффективность измерений

Общая трудоемкость дисциплины: 14 з.е.

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен